

I o T技術セミナー
MTシステムを用いたセンサデータの解析
—製造現場の異常診断への適用—
開催のご案内

主催：石川県工業試験場
共催：ものづくり産業等I o T化推進研究会

製造現場に設置した様々なセンサからのデータを収集・解析することにより、製造現場の異常の有無を自動的に診断するI o T技術が注目されております。

このデータ解析の手法としては、深層学習技術が大きな期待を集めていますが、深層学習は非常に高度な解析が可能な一方で大量のデータが必要であり、データが十分に取得できない場合には適用できないことがあります。これに対し、品質工学の分野で提唱されている解析手法であるMTシステムは、少量のデータに対しても適用できて強力な解析ができることから、手軽で製造現場に導入しやすいデータ解析方法として利用されています。

本セミナーでは、MTシステムによるセンサデータの解析方法を解説するとともに、製造現場の異常診断への適用例について紹介します。また、その具体的な方法や効果を実感していただけるよう、MTシステムを用いた異常診断の実験・実演も行います。

多数ご参加下さいますようご案内いたします。

[日 時] 平成30年11月20日(火) 13:30~16:30

[場 所] 石川県工業試験場 2階 第2会議室(金沢市鞍月2丁目1番地)

[講 師] 国立研究開発法人産業技術総合研究所

製造技術研究部門 センサシステム技術研究グループ

主任研究員 **石田 秀一 氏**

[受講料] 無料

[定 員] 30名

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地

石川県工業試験場 担当：米沢、笠原

e-mail: iot@iriii.jp TEL: (076)267-8084 FAX: (076)267-8090

[締切り] 平成30年11月13日(火) (定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してお申込みください —————

I o T技術セミナー：「MTシステムを用いたセンサデータの解析」

日 時：平成30年11月20日(火) 13:30~16:30

場 所：石川県工業試験場 2階 第2会議室(金沢市鞍月2丁目1番地)

会 社 名

住 所(〒)

電話

所 属	氏 名	e-mail